



Warszawa, dnia 2016.-01-22. r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „**Dostawa zestawu do analizy powierzchni (XPS) w warunkach niskiej próżni wraz z wyposażeniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III)**” Nr 120/47/2013.

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Wniosek:**

1. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.1. Hemisferyczny Analizator Energii do Podwyższonych Ciśnień XPS, UHV-XPS, UPS, ARPES, AES, SAM, ISS oraz LEIS:

- detektor z linią opóźniającą z MCP ze stosem jodełkowym

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważnego detektora o takich samych lub lepszych parametrach?

2. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.1. Hemisferyczny Analizator Energii do Podwyższonych Ciśnień XPS, UHV-XPS, UPS, ARPES, AES, SAM, ISS oraz LEIS:

- detektor 2D(x, y)/3D(x, y, t) do równoległej migawkowej akwizycji energii i widm rozdzielczych kąto- oraz akwizycji danych rozdzielczych czasowo



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważnego detektora o takich samych lub lepszych parametrach?

3. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.1. Hemisferyczny Analizator Energii do Podwyższonych Ciśnień XPS, UHV-XPS, UPS, ARPES, AES, SAM, ISS oraz LEIS:

- rozdzielczość czasowa: <240 ps całkowita

Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego rozdzielczość czasowa jest ważna?

Określony parametr rozdzielczości czasowej nie jest istotny dla pomiarów rozdzielczości czasowej.

4. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.3. Monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego.

- duży pojedynczy kryształ o wymiarach co najmniej 100mm x 200mm, wysokiej transmisji i łatwym osiowaniu

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie kilku kryształów jeśli dzięki temu mogą być osiągnięte lepsze parametry transmisji przy łatwiejszym osiowaniu?

5. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.3. Monochromatyczne źródło promieniowania rentgenowskiego.

- średnica plamki zmienna w zakresie co najmniej 200µm do 600µm

Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego ten parametr jest istotny?

6. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §1. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 3. – Specyfikacja systemu do Spektroskopii Fotoelektronów Rentgenowskich pracującego w warunkach podwyższonego ciśnienia (NAP – Near Ambient Pressure, Ciśnienie Bliskie





Atmosferycznemu) zawierającemu akcesoria oraz system preparacji, wprowadził następujący zapis:

Pkt. 3.2. Elementy do analizy powierzchni. Pkt. 3.2.5. Źródło promieniowania UV.

- mikrofalowe źródło UV do wydajnej pracy z różnymi gazami (He, Ne, Ar, Xe, ...)

Czy Zamawiający może wyjaśnić dlaczego źródło UV musi być mikrofalowe? Czy Zamawiający dopuszcza inny typ źródła UV?

7. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §2. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 2. – Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na:

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i internetową. Czas reakcji serwisu do 24 godzin od momentu powiadomienia serwisu do rozpoczęcia naprawy. Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia przystąpi do niezwłocznego zdiagnozowania zaistniałego problemu.

8. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 3. §2. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 2. – W przypadku przestoju dłuższego niż 14 dni gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na:

W przypadku przestoju dłuższego niż 30 dni gwarancja ulega przedłużeniu o czas przestoju.

9. Zamawiający w Rozdziale I, Art. 4. §1. SIWZ – Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów (...), Pkt. 3.2. – Posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie min. dwóch dostaw systemów do analizy powierzchni w warunkach podwyższonego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 brutto każda z nich,

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca wykaże główne dostawy wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez główne dostawy Zamawiający rozumie wykazanie min. jednej dostawy systemu do





analizy powierzchni w warunkach podwyższonego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 brutto każda z nich,

10. Zamawiający w Rozdziale I II, Wzór umowy. §8. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 6. – Łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 nie może przekroczyć łącznie 10% ceny określonej w § 6 niniejszej umowy.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na:

Łączna wysokość kar umownych z tytułów przewidzianych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 nie może przekroczyć łącznie 5% ceny określonej w § 6 niniejszej umowy.

11. Zamawiający w Rozdziale I II, Wzór umowy. §9. SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. 4. – Gwarancja obejmuje wymianę materiałów zużywalnych oraz przeprowadzenie w trakcie jej trwania (przynajmniej raz do roku) przeglądu zaoferowanej aparatury, wymiany części zużywalnych np. filtrów HEPA, uszczelek itp.

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie tego zapisu? Materiał zużywalny stanowi elementy eksploatacyjny nie podlegający wymianie gwarancyjnej.

### Odpowiadamy:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Parametr jest istotny ze względu na rodzaj prowadzonych badań przez Zamawiającego.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Parametr jest istotny ze względu na rodzaj prowadzonych badań przez Zamawiającego.

Ad. 6. Tak, Zamawiający dopuszcza inne (równoważne), źródła UV, z uwzględnieniem pracy z gazami He, Ne, Ar, Xe, ...

Ad. 7. Nie.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Nie.

Ad. 10. Nie.

Ad. 11. Nie.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII  
UNIwersytetu Warszawskiego

*Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza*



**INNOWACYJNA GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

